



もっと早く。もっと効率的に。

## WDS/EDS インテグレーションシステム

最大限効率的かつ正確な元素分析を、容易に

### ● メリットを集約して正確な分析を効率的に

WDS/EDSインテグレーションシステムにより、効率的で正確な元素分析を行うことができます。主成分をEDSで、微量元素をWDSで分析する事により、広範囲のステージスキャンマップや、定量分析において効率的なデータ収集に最大限の力を発揮します。JXA-iSP100/iHP200Fは、EDSや蛍光X線分析装置（XRF）の定量分析データからWDSの分析元素条件設定ができるようになりました。分析元素は自動的に最適な分光結晶に設定されます。XRFでは、短時間で広範囲の微量元素をppmオーダーまで分析できるため、事前測定を行うことで、分析元素の見落としを低減することができます。



#### WDSのメリット

- ✓ 最大5チャンネルで分析
- ✓ 大電流で微量元素検出(1 nA ~ 10 μA)
- ✓ 高精度定性・定量分析
- ✓ 優れた波長分解能による状態分析
- ✓ 軽元素の検出感度が高い

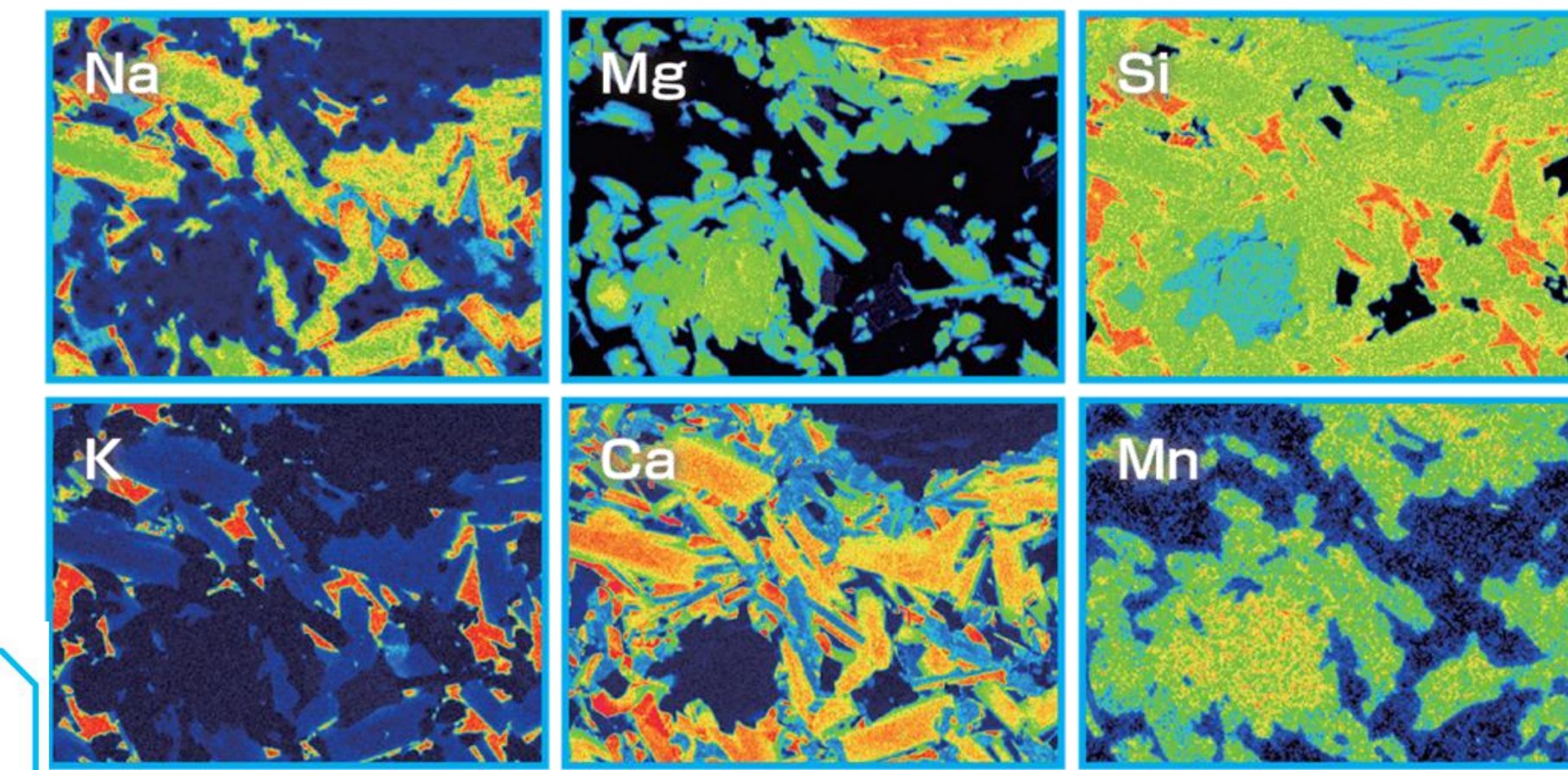


#### EDSのメリット

- ✓ 多元素同時分析
- ✓ 像観察と同じ条件で分析
- ✓ 短い分析時間
- ✓ 試料損傷の少ない分析

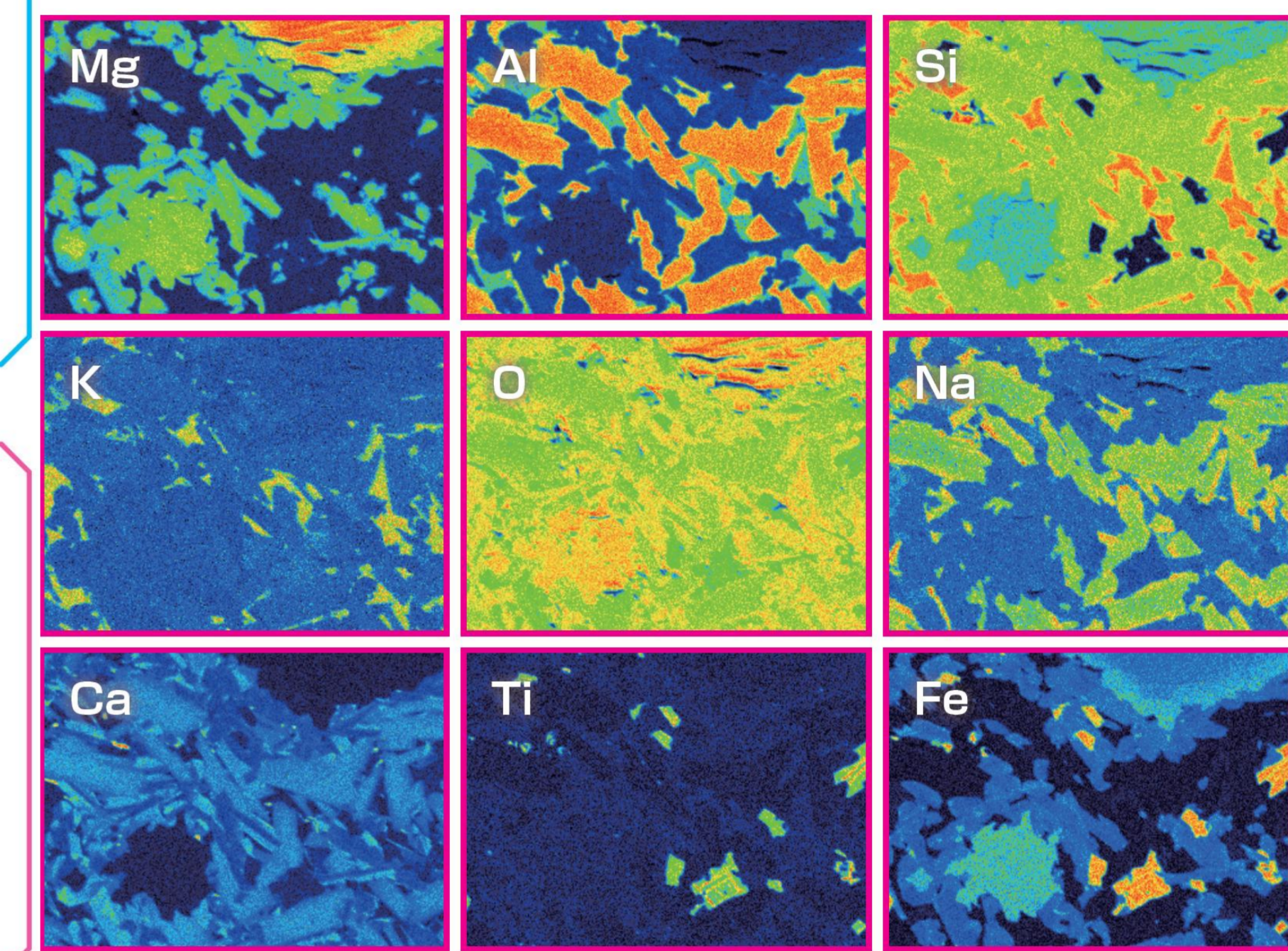


WDS



試料：玄武岩

EDS



50 μm



もっと簡単に。もっと正確に。

## かんたんEPMA

どうやって操作すればいいの？

そんな人には「かんたんEPMA」

簡易的な分析ならば SEM, EPMA, EDSをひとつの画面で制御できます。

「分析モード」「感度/速度」「分析位置」「分析元素」を選択するだけで、電子光学条件や測定時間、ステージモード or ビームモード、測定X線、分光結晶、チャンネル等のWDS分析に必要な条件は全て自動で設定されます。



分析モード  
選択

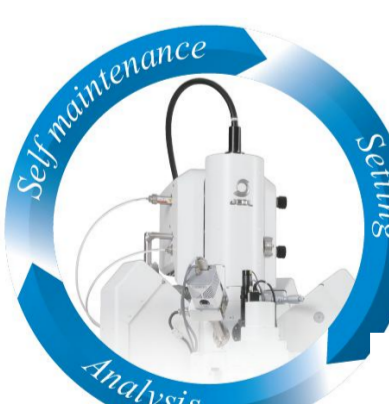
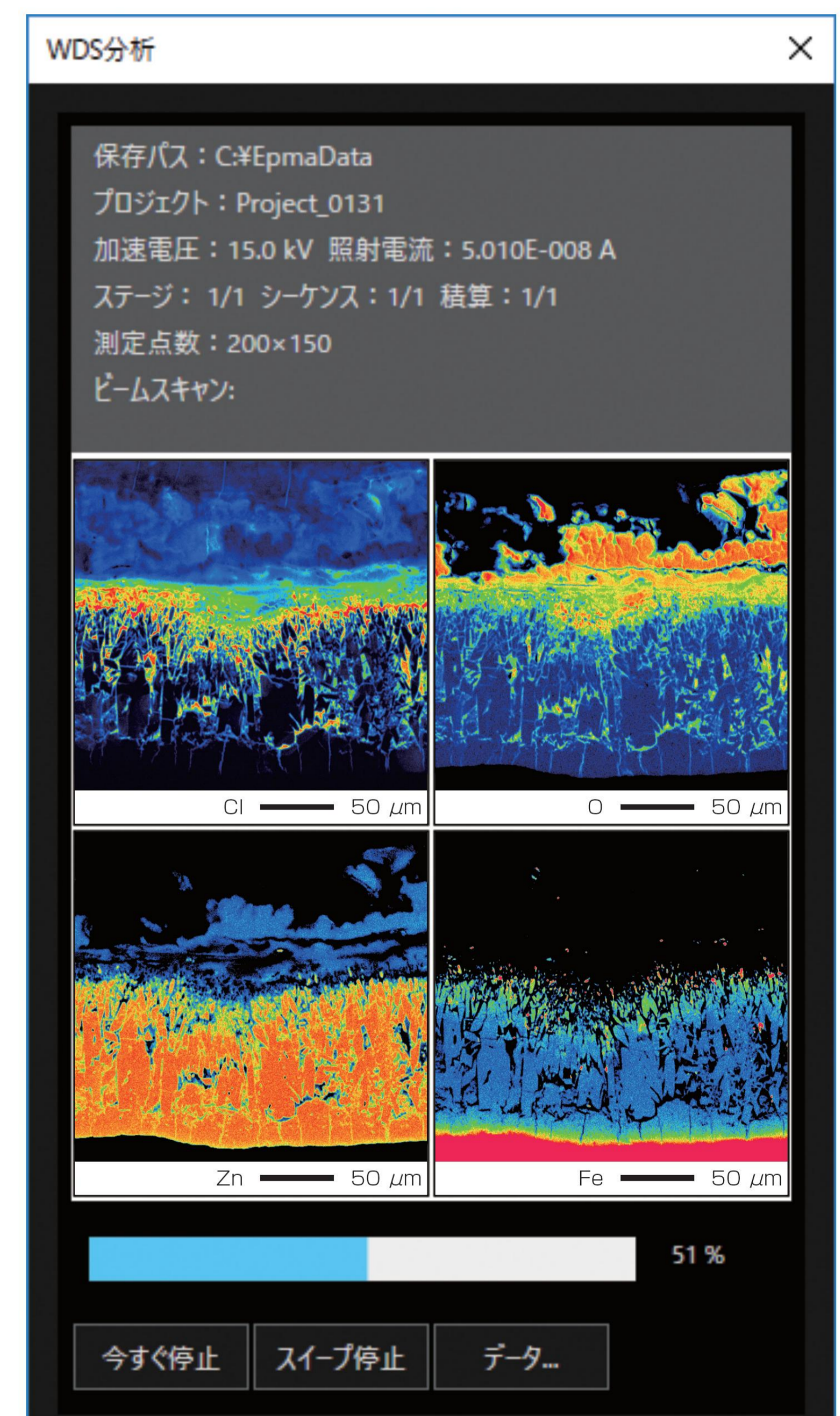
速度/感度  
選択

測定条件  
自動設定

分析位置  
設定

分析元素  
選択

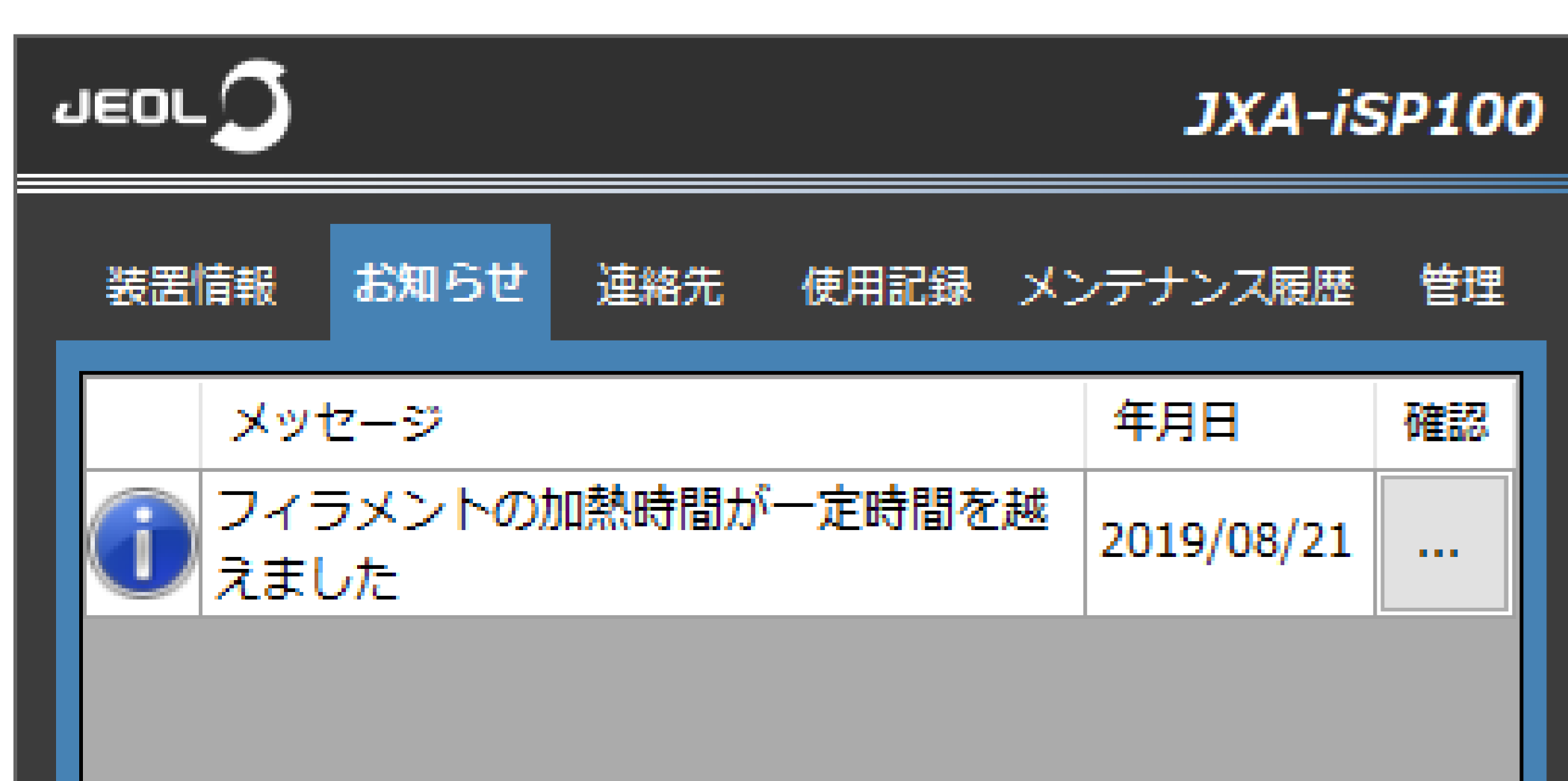
測定開始



## セルフメンテナンス

セルフメンテナンスを簡単・確実に！ 分光器校正機能とメンテナンス通知機能

フィラメント交換や分光器校正、必要な時期に確実にメンテナンスを行うことができるため、装置の状態が最良の状態に保たれます。また、校正用試料が内蔵されているため、いつでも装置のチェックを行う事ができます。



標準試料名	X	Y	Z
Cd_J18	28.0464	-58.1726	10.6645
W_J18	25.5828	-58.1450	10.6945
Au_J18	22.9726	-58.2707	10.6765
Cr_J18	28.2294	-55.7066	10.7060
Ni_J18	25.6330	-55.6622	10.7010
Cu_J18	22.9017	-55.5743	10.6940
Zr_J18	20.8297	-56.3539	10.6995
Mo_J18	18.0290	-57.5158	10.6995

